STC32G12K128 实验箱V2.0
STC8H8K64U 实验箱V2.0
2024-06-29

与内部 1.19V 基准电压比较

掉电检测

悬挂电压默认使用 3V0AVCC
使用 ADC 对可通过内部 1.19V 做参考反推被测电压

悬挂电压默认使用 3V0AVCC
使用 ADC 对可通过内部 1.19V 做参考反推被测电压

使用 P5.4 当作复位输出，连至用三内部的 RC 上电复位的 rst 开。瞬间拔出一直电，此时观察 ST 调试相应的 MCU 内部 IAP 15 F413E 是否上电复位

使用硬件触发时可实现对单片机复位功能，触发 ST。使用可编程逻辑高电平复位，低脉冲调试

8个独立 LED指示灯 实验

低电平复位

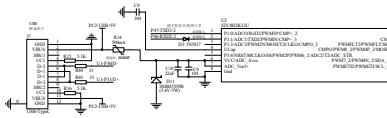
串口2通讯指示灯

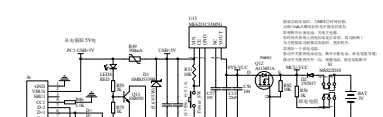
3线制SPI串行总线接口实验

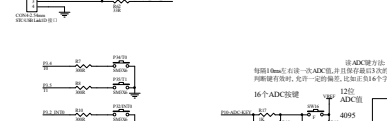
2线制I2C串行总线接口实验

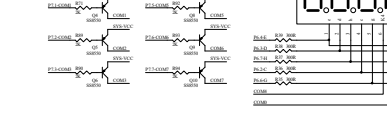
P4.1为高时 U9 SRAM处于非选中状态。
这时 SRAM被挂到单片机的所有端口处于高阻输入状态，不影响单片机的 I/O口正常工作

外部并行总线扩展32K SRAM









读ADC键方法:
每隔10ms左右读一次ADC值,并且保存最后3次的读数,其变化比较小时再判断键.
判断硬件取样, 允许一定的偏差, 比如正负1.6个字的偏差.

16个ADC按键

12位 ADC值

4095
3840
3584
3328
3072
2816
2560
2304
2048
1792
1536
1280
1024
768
512
256

矩阵式键盘，可用扫描法识别按键

如果使用单片机片外总线就不要使用上面的P0口行列矩阵按键扫描电路
改用下面的ADC按键检测电路